WK3260B精密磁性元件分析仪
WK3255B电感分析仪 系列

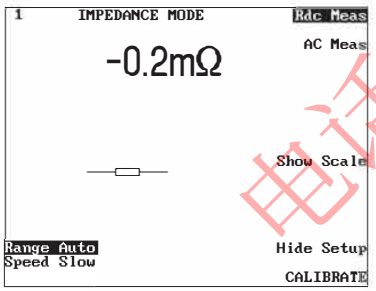
1J3255BL 频率范围 20Hz ~ 200kHz
1J3255B 频率范围 20Hz ~ 500kHz
1J3255BQ 频率范围 20Hz ~ 1MHz
1J3260B 频率范围 20Hz ~ 3MHz

WK3260B 精密磁性元件分析仪/WK3255B电感分析仪

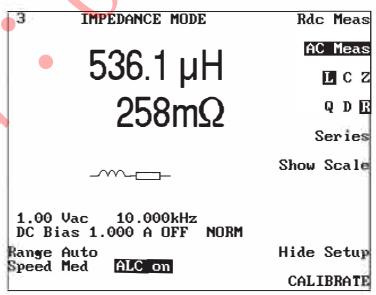
产品特色

- 0.1% 基本精确度（英国标准），电感、变压器业界公认最佳标准仪器
- 测包机超速测试，加载2A DC Bias，52颗 / Min.
- 四线式测试，可精确量测极低的Rdc、Rs 及L 与精准Q
- 外加DC Bias（直流偏压电流）最高可到250A (选配)
- WK3255B 可内置1A DC Bias（选配)
- WK3260B 内置1A DC Bias可直接画出磁饱和曲线或多点DC Bias 与多点频率自动检测功能
- 涵盖Rdc（直流电阻)及Turn Ratio（圈数比），初级、次级漏电感与层间电容测试等变压器测试参数
- 测试解决方案：Layer Short，可直接量测六项DC Bias Ramp up 及 Ramp down参数，不需人工换算
- 仪器内阻50Ω，但具备定电压（ALC）及定电流功能，可全方位精确测试
- SMD，DIP以及异形组件的200A高电流之测试治具齐全
- 提供 Factory view 软件计算机连接功能
- 具真正温升曲线测试功能，非Rdc换算

电话：0512-63976840

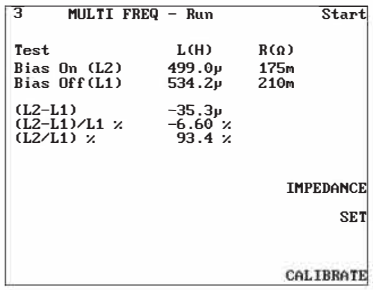


搭配1J1015、1J1016 等治具可真四线式量测，真正可测出极低的Rdc、Rs 及L 与精准Q

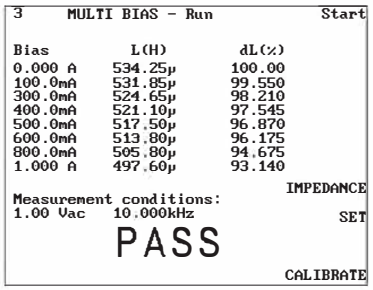


具备ALC 功能,可在待测物上进行定电压 / 定电流量测，可忽略各种仪器因内阻不同而产生的量测差异

可连续供应250A直流偏压电流一小时以上



New: DC Bias ramp up and ramp down 磁饱和六项参数自动测试功能



多点自定义Bias测试功能

连机测试软件(GPIB接口)

产品规格

型　　号	1J3255BL	1J3255B	1J3255BQ	1J3260B
频率范围	20Hz~200kHz	20Hz~500kHz	20Hz~1MHz	20Hz~3MHz
参　　数	L、Z、Rdc、C、Q、D、Rac 、θ、漏电感、圈数比、层间电容			
基本精确度 (英国标准)	0.1%			
测量电压/电流	1 mV ~ 10 Vrms；50 μA ~ 200 mArms*			
直流偏压电流	内置：1mA ~ 1Amp 或1mA ~ 2Amp 外接：WK3265 Series Bias Unit		内置：1mA ~ 1Amp 外接：WK3265 Series Bias Unit	
测试模式	多点DC Bias测试、多频测试模式、 自动测试模式		1. 多点DC Bias 测试、多频测试模式、自动测试模式 2. 共振查找模式、消磁模式、波形扫频功能、通信变压器测试、耐压、阻抗模式、变压器模式	
量测速度	最快、快速、中速及慢速			
量测范围	R 0.05 mΩ ~ >2MΩ L 1nH ~ >1000H C 10fF ~ >250mF		R 0.01 mΩ ~ >2GΩ L 0.1 nH ~ >1000H C 5 fF ~ >1 F	
测试功能	定电压、定电流 / DC Bias Ramp up 和 Ramp down功能			
仪器内阻	50Ω			
耗电量	150VA		400VA maximum	
测试接点	BNC 接头 1组		BNC 接头 2组	
测试线	4线式（Kelvin）		2线式或 4线式（Kelvin）	
综合参数	使用电源230 VAC ±10%；115 VAC ±10%			
	显示屏幕为高亮度LCD			
	温度0℃ ~ 40℃（操作），-40℃ ~ +70℃（保存），相对湿度≤ 80%			
	尺寸（mm）150/H × 440/W × 520/D，重量11kg			

* Varies with frequency

WK3255B系列	WK3260B
操作手册、电源线	操作手册、电源线、高频校准电容

选用配备一览表

/A 1mA-1A 内置直流偏置	/G 分析模式
/B GPIB (IEEE488) 接口	/N 绝缘电阻
/D 分选卡	/T LF Telecom Function
/S 直流偏置快速ramp up和ramp down(NEW)	
/U 1mA-2A 内置偏流(3255)	

* 相关测试治具及配件详见本型录治具介绍篇

电话：0512-63976840